

Mikroskopische Bestimmung thermischer und struktureller Eigenschaften dünner Schichten durch modifizierte Raster-Sonden-Verfahren

Motivation

Analytik dünner und ultra- dünner Schichten

Vorgehen

Bestimmung der thermischen Leitfähigkeit dünner Schichten. Ziel des geplanten Vorhabens ist die Entwicklung, der Bau und die Erprobung eines Zusatzmoduls (Add-on Modul) für Raster-Sonden-Mikroskope (RSM) zur thermischen Charakterisierung dünner Schichten und nanostrukturierter Materialien wie sie beispielsweise für Thermogeneratoren benötigt werden. Im Rahmen des beantragten Vorhabens soll das Modul in Verbindung mit bereits etablierten Mess- und Charakterisierungsmethoden eingesetzt werden.

Eckdaten	
Kurztitel	3ω-Microscopy
Forschungsschwerpunkt	Sustainable Production, Energy Technologies and Smart Materials
Laufzeit	01.09.2012 - 31.08.2015
Fördergeber	Bundesministerium für Bildung und Forschung
Projektleitung	Prof. Dr.-Ing. Günther Benstetter



UWS UNIVERSITY OF THE
WEST of SCOTLAND

